



中华人民共和国国家标准

GB/T 17550.3—1998
idt ISO/IEC 11694-3:1995

识别卡 光记忆卡 线性记录方法 第3部分:光属性和特性

Identification cards—Optical memory cards—
Linear recording method—Part 3:
Optical properties and characteristics

1998-11-05 发布

1999-06-01 实施

国家质量技术监督局 发布

目 次

前言	Ⅲ
ISO/IEC 前言	Ⅳ
引言	V
1 范围	1
2 引用标准	1
3 读/写测试条件	1
4 光特性	1
5 读特性	2
6 缺陷	2

前 言

本标准等同采用国际标准 ISO/IEC 11694-3:1995《识别卡 光记忆卡 线性记录方法 第3部分:光属性和特性》。

GB/T 17550 在总标题《识别卡 光记忆卡 线性记录方法》下,包括下述部分:

- 第1部分:物理特性;
- 第2部分:可访问光区域的尺寸和位置;
- 第3部分:光属性和特性;
- 第4部分:逻辑数据结构。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由电子工业部标准化研究所归口。

本标准起草单位:电子工业部标准化所。

本标准主要起草人:冯敬、冯惠、李韵琴、蔡怀忠、陈云峰。

ISO/IEC 前言

ISO(国际标准化组织)和IEC(国际电工委员会)建立了世界范围标准化的专门系统。ISO或IEC的国家成员团体通过国际组织建立的各个技术委员会参与制定针对特定技术领域的国际标准。ISO和IEC技术委员会在共同感兴趣的领域合作。其他与ISO和IEC有联系的官方和非官方的各国际组织也参与此项工作。

在信息技术领域,ISO和IEC建立了一个联合技术委员会,即ISO/IEC JTC1。由联合技术委员会提出的国际标准草案需分发给各成员团体进行表决。作为国际标准发布至少需要75%的成员团体投票赞成。

国际标准ISO/IEC 11694-3由联合技术委员会ISO/IEC JTC1(信息技术)的分委员会SC17(识别卡及相关设备)制定。

ISO/IEC 11694 在总标题《识别卡 光记忆卡 线性记录方法》下包括下述部分:

- 第1部分:物理特性;
- 第2部分:可访问光区域的尺寸和位置;
- 第3部分:光属性和特性;
- 第4部分:逻辑数据结构。

引 言

本标准是描述光记忆卡的参数以及如何使用这种卡存储和数字数据交换的系列标准之一。

本标准认为记录和读光记忆卡信息存在着不同的方法,其特性也随所使用的记录方法而确定,通常,这些不同的记录方法彼此是不兼容的。因此,本标准采用一种一致的方法来组织,使之适应现存的以及将来的记录方法。

本标准专用于使用线性记录方法的光记忆卡。适用于其他特定的记录方法的特性可以在独立的标准文件中找到。

本标准定义了光属性和特性以及符合、加入和/或不符合此相关的基本文件 GB/T 17551 的范围。

中华人民共和国国家标准

识别卡 光记忆卡 线性记录方法

第3部分:光属性和特性

GB/T 17550.3—1998
idt ISO/IEC 11694-3:1995

Identification cards—Optical memory cards— Linear recording method—Part 3: Optical properties and characteristics

1 范围

本标准定义了使用线性记录方法的光记忆卡的光属性和特性。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 17551—1998 识别卡 光记忆卡 一般特性(idt ISO/IEC 11693:1994)

ISO/IEC 11694-4:1996 识别卡 光记忆卡 线性记录方法 第4部分:逻辑数据结构

3 读/写测试条件

注:除另有规定外,这些测试条件适用于所有的测试。

3.1 光源

光源应是波长为 760 nm 到 850 nm 之间的半导体激光二极管。

3.2 光束直径

光层表面的聚焦光束应在 $1/e^2$ 的点上测得。每次测试应定义特定的光束直径。

3.3 读功率

光层表面的读功率应小于 0.50 mW。

3.4 缺省测试环境和条件

采用 GB/T 17551 中定义的缺省测试环境和条件参数。

4 光特性

在本标准中定义的测试条件下,期望达到这些特性。如果测试条件变化了,则在这里定义的光特性也会改变。

4.1 最低性能特性

本条内所包含的值均表示为了信息交换可接受的最低程度。因此,除卡的物理损坏之外,在卡的使用寿命期间,这些值表示了光卡应满足或超过的特性。

注:使用寿命的定义因应用而异。因此,将其留给卡的制造者和发行者,为他们特定的实现而做适当的定义。

4.1.1 背景反射率

所测得的相邻轨迹间的区域的反射率,应在 12%~18%之间或 27%~48%之间。在一张卡内,背景反射率不得超过平均值的 10%。